Relatório Final de Iniciação Científica PIBIC/CNPq-PRP/UNICAMP

"Estudo da superfície de ZnO(0001) reconstruída em (1x1) e (2x2) via Difração de Fotoelétrons"

Aluno: lago Aédon Silva Prior - RA:141744

Orientador: Prof. Abner de Siervo

Departamento de Física Aplicada, Instituto de Física "Gleb Wataghin"-UNICAMP

Resumo

O óxido de Zinco (ZnO) é um material que possui várias aplicações importantes como em optoeletrônica. A estrutura a ser estudada é a wurtzita na direção (0001) terminada em Zn, e com reconstruções (1x1) e (2x2) da estrutura. Há poucos estudos do ZnO na literatura, em particular para a reconstrução (2x2), e estudar essas reconstruções serão de grande valia para outros projetos desenvolvidos no grupo. Neste projeto, iremos utilizar a técnica de difração de fotoelétrons excitados por fótons de raios X (PED ou XPD) para realizar a determinação estrutural e comparar as reconstruções (1x1) e (2x2).

1-Introdução e Objetivos:

Uma maneira eficiente de se estudar a estrutura eletrônica e atômica de um material é "colidir" partículas com o mesmo e investigar as propriedades das partículas que são emitidas. As partículas iniciais podem ou não ser do mesmo tipo das que saem (por exemplo, incidir fótons e medir os fotoelétrons emitidos). Usaremos esse método para estudar a superfície do material alvo, o ZnO, descobrir sua composição química, estrutura geométrica e propriedades eletrônicas da superfície.

Para o nosso caso, utilizaremos a técnica de PED (Photoelectron Diffraction) e teremos as partículas iniciais sendo fótons de baixa energia (1253.6 eV ou 1486.6 eV); o alvo feito de material de óxido de Zinco(ZnO), um sólido com uma banda proibida de energia (gap) de 3.6 eV e elétrons sendo emitidos que vão chegar no detector.

O óxido de zinco é um composto químico inorgânico de cor branca em formato de pó sendo insolúvel em água, com fórmula molecular dada por ZnO, sendo produto da corrosão do zinco em atmosfera relativamente seca:

$$2Zn_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2ZnO_{(s)}$$

É amplamente utilizado como aditivo em vários materiais e produtos como borracha, plástico, cerâmica, vidro, lubrificantes, etc.

Seu cristal é um semicondutor do grupo II-IV, e possui boas propriedades como sendo um bom material transparente, alta mobilidade de elétrons, largura de banda larga e possui luminescência à temperatura ambiente. A sua massa molar é de 81.4084 g/mol, seu ponto de fusão de 2248.15 K e um GAP de aproximadamente 3.37 eV. Possui várias aplicações como em eletrônicos como transistores de filmes finos e diodos emissores de luz. Uma de suas estruturas é uma rede hexagonal em formato de wurtzita, onde possui sítios tetraédricos.

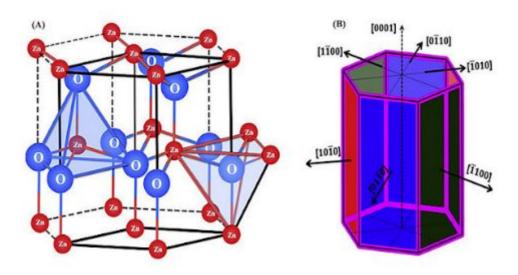


Figura 1. Estrutura hexagonal wurtzita de ZnO e seus respectivos sítios tetraédricos representados em (A) e suas respectivas direções cristalográficas representadas em (B).

2- Materiais e Métodos:

2.1-Técnica de PED (Photoelectron Diffraction):

No experimento de PED, o fóton incidente interage com o material, podendo ocorrer emissão de elétrons e fluorescência de raios-X. No caso da emissão de elétrons, dois tipos de mecanismos contribuem para emitir elétrons, que são o efeito fotoelétrico e a emissão de elétrons Auger. Devido ao curto livre caminho médio (IMFP), somente os elétrons emitidos próximos da superfície conseguem sair para o vácuo e serem detectados. Por esta razão essa técnica é sensível à superfície. Esse elétron ao interagir com o material ele pode sofrer espalhamento elástico e inelástico. Para os experimentos em questão, estaremos interessados apenas nos elétrons que sofrem espalhamento elástico (produzem um pico de fotoemissão). Estes podem ser simples, logo no primeiro potencial espalhador e chegar ao detector, ou podem sofrer múltiplos espalhamentos elásticos com os átomos de seu entorno e chegar ao detector com um desvio de fase. Então ao chegar ao detector após sofrer os espalhamentos elásticos, esses elétrons carregam informação do potencial

espalhador e da estrutura do material em que ele sofreu espalhamento. Já o espalhamento inelástico vai contribuir para o background não chegando a ter importância no experimento, só contribuindo para aumentar um sinal de fundo (background). O elétron pode ter o comportamento de partícula-onda, então se olharmos para o caso do elétron como uma onda propagando, chegarão ao detector elétrons com espalhamentos simples e múltiplos, esses elétrons chegarão com diferentes amplitudes e fases e formarão um padrão de interferência construtiva ou destrutiva. Ocorre então uma modulação na intensidade observada no analisador de elétrons em função da energia cinética e direção de emissão dos elétrons. A este padrão de interferência chamamos convencionalmente de padrão de difração de fotoelétrons ou elétrons Auger (dependendo da natureza do pico detectado).

2.2- Procedimento Experimental:

O procedimento experimental consiste em se ter uma fonte de raios X, um ambiente de ultra-alto vácuo (UHV) e um analisador de elétrons. A técnica de PED consiste em medir a intensidade dos elétrons que chegam ao analisador de elétrons através de uma varredura em ângulo ou em energia, obtendo um padrão de difração experimental. Nosso grupo realiza a varredura em ângulo, onde se fixa a energia do fóton incidente e varia-se a posição angular da amostra de forma polar θ e azimutal ϕ .

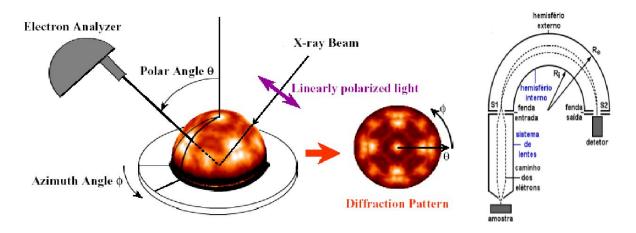


Figura 2. Esquema representativo do experimento de PED obtendo um padrão de difração após passar pelo analisador de elétrons.

Os raios X podem ser gerados por um tubo de raios X ou através de radiação sincrotron. O vácuo é importante para evitar que os elétrons emitidos do material se choquem com outras partículas antes de chegar ao detector e principalmente para manter limpa e inalterada a superfície analisada.

O analisador de elétrons utilizado é o analisador hemisférico, onde os elétrons entram pelo sistema de lentes e são focalizados na fenda de entrada. Os elétrons chegam com certa energia cinética e devem percorrer o capacitor hemisférico saindo de S1 e chegando em S2, onde apenas elétrons com certo

intervalo de energia conseguem percorrer todo o caminho e chegar ao detector, os outros elétrons serão defletidos para hemisfério externo ou interno.

2.3- Código para PED:

Durante a técnica experimental, é obtido o padrão de difração experimental. Esse padrão de difração nos dá informação sobre o tipo de estrutura a ser estudada. Por outro lado, é extremamente difícil de se obter a informação a respeito da estrutura do material diretamente dos dados experimentais. O procedimento envolve simular um padrão de difração teórico pela proposição dos potenciais espalhadores e da estrutura e então comparar com os dados experimentais. Na simulação utilizamos o software MSCD [5] (Multiple Scattering Calculation of Diffraction). Propõe-se uma estrutura cristalina e um "cluster" de átomos. Realizam-se cálculos teóricos de espalhamento, obtendo ao final um padrão de difração que poderá ser comparado ao dado experimental. Para comparar o dado experimental com o teórico utiliza-se o fator-R (Reliability Factor). Esse fator-R avalia a qualidade do ajuste, o grau de confiabilidade em relação ao dado experimental. Em PED este é tipicamente definido como fator R_a e é dado como:

$$R_a = \frac{\sum\limits_{i} (\chi_i^e - \chi_i^t)^2}{\sum\limits_{i} (\chi_i^e)^2 + (\chi_i^t)^2}$$
 , com $0 \le R_a \le 2$.

Se $R_a \rightarrow 0$ o ajuste é considerado perfeito.

Se $0.5 \le R_a \le 1$, o modelo estrutural provavelmente não corresponde à estrutura experimental.

Se $R_a \rightarrow 2$ indica anti-correlação.

2.4- Simulação do ZnO(0001):

A simulação do ZnO foi feita utilizando o pacote MSCD, um cluster de formato elipsoidal com aproximadamente 250 átomos. Esse cluster é construído camada por camada no input do código de forma bidimensional, formando vários planos atômicos com uma distância entre eles que ao juntar todos os planos, forma-se o cluster tridimensional.

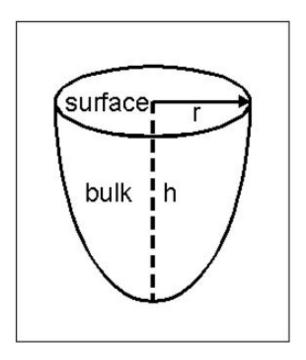


Figura 3. Desenho ilustrativo mostrando o formato e o tamanho do cluster.

Uma rede é dita simétrica, se ao realizarmos operações de translação, rotação ou reflexão da rede, a estrutura cristalina é transformada nela própria respeitando a lei de simetria das redes. Para construir cada camada, o MSCD possui regras bem definidas, buscando respeitar as leis de simetria do cristal. Cada camada que o MSCD constrói se chama camada lógica e às vezes é necessário mais que uma camada lógica para se construir uma camada física que é a camada completa pertencente ao plano escolhido. Vamos definir então as regras em relação à cada camada lógica plana bidimensional com eixos x e y.

Regras do MSCD:

- Definir um vetor \vec{a}_1 com certo ângulo θ_1 em relação à x.
- Definir um vetor \vec{a}_2 com certo ângulo θ_2 em relação à x.
- Definir um vetor \vec{a}_3 que será a origem do par de vetores \vec{a}_1 e \vec{a}_2 com certo ângulo θ_3 em relação à x.
- Definir a distância de em relação ao plano anterior.

Experimentalmente foram observadas duas reconstruções diferentes ((1x1) e (2x2)) que eram dependentes da metodologia de preparação da amostra (em UHV ou em atmosfera de O_2).

Foram feitas duas construções de redes, a (1x1) e (2x2) na direção (0001), com o intuito de compará-las.

O input do código além de possuir informação de todas as camadas lógicas utilizadas para se construir as camadas físicas da estrutura a ser estudada seguindo a regra apresentada, possui outros parâmetros a serem levados em consideração sendo que os mais importantes são o raio do cluster, profundidade do cluster, número de camadas lógicas usadas para construir o cluster, o parâmetro de rede, o ângulo de aceitação, o número de camadas emitindo, distâncias interplanares(d_{12} , d_{23} , d_{34} , etc) e o número de átomos utilizados para construir o cluster. Esses parâmetros são os principais influenciadores no fator R_a e devem ser otimizados a fim de se obter o melhor resultado.

2.4.1- Estrutura de ZnO(1X1):

A estrutura ZnO (1x1) na direção (0001) possui 4 camadas físicas que se repetem periodicamente, como podemos ver na figura 4.

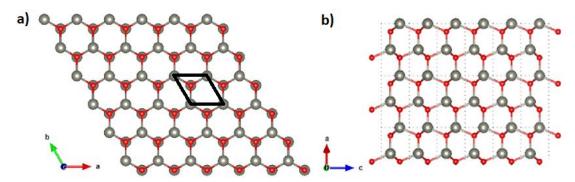


Figura 4. Estrutura de ZnO 1x1 vista na direção (0001) em **a**), e vista lateralmente em **b).** Onde as esferas vermelhas são o O e as cinzas são o Zn, com a superfície terminada em Zn. E a linha preta indica a superfície reconstruída em 1x1.

2.4.2- Estrutura de ZnO(2X2):

No estudo da estrutura ZnO(2x2) na direção(0001) há uma vacância de oxigênio na primeira camada, e há várias possibilidades de modelos que possam ser criados e testados a fim de obter a estrutura que corresponda ao dado experimental.

Devido a estrutura possuir buracos na primeira camada, podemos ter estruturas com terminações em Zn-A ou Zn-B.

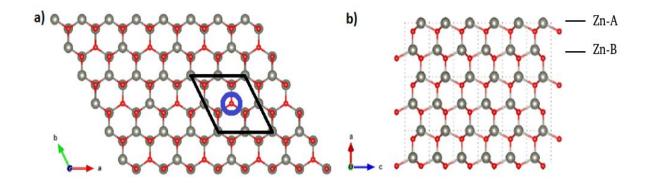


Figura 5. Estrutura de ZnO (2x2) onde as esferas vermelhas são o O e as cinzas são o Zn. Em a) temos a vista na direção (0001) com a linha preta indicando a primeira camada reconstruída em 2x2 com uma vacância de Zinco no centro representada pelo círculo em azul. Em b) é vista lateralmente podendo a estrutura ser terminada em Zn-A ou Zn-B.

Devido a estrutura possuir buracos na primeira camada, temos 8 combinações possíveis de se montar a primeira camada tanto na terminação em Zn-A como em Zn-B. E também temos que as configurações 1,3,5 e 7 possuem uma estrutura com preferência a formar triângulos completos enquanto as configurações 2,4,6 e 8 formam triângulos incompletos.

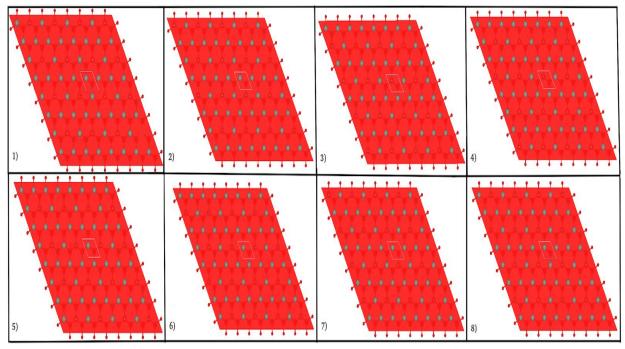


Figura 6. Todas as 8 possíveis configurações da primeira camada de Zn da estrutura terminada em Zn-A.

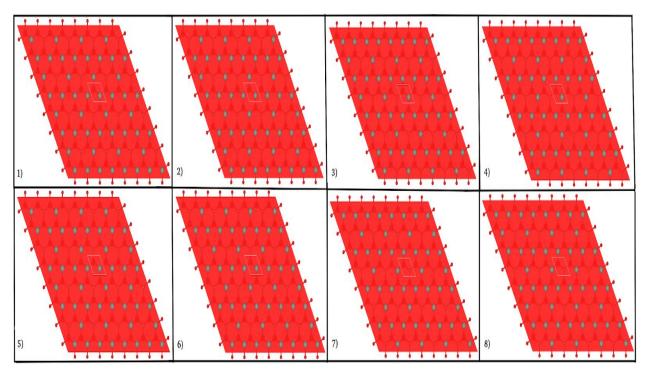


Figura 7. Todas as 8 possíveis configurações da primeira camada de Zn da estrutura terminada em Zn-B.

3- Resultados:

Os resultados encontrados comparam o dado experimental com o teórico calculado. Com o intuito de encontrar a estrutura mais próxima dos dados experimentais, foram feitas relaxações nas distâncias interplanares das estruturas estudadas, diminuindo assim o fator R_a em relação ao bulk. Ao se encontrar o menor fator Ra, podemos comparar as distâncias interplanares obtidas com a literatura.

Tabela 1. Comparação entre as distâncias interplanares dos resultados obtidos com a literatura e suas respectivas porcentagens de relaxação.

	d ₁₂	relax.	d_{23}	relax.	d_{34}	relax.
Bulk ^(a)	0.640		2.0100		0.6400	
(1x1) ^(a)	0.460	-28,12%	2.1200	+5,47%	0.5800	-9,37%
(1x1) ^(b)	0.430	-32,81%	2.1460	+6,46%	0.5280	-17,5%
(1x1) ^(c)	0.460	-28,12%	2.1100	+4,97%	0.5800	-9,37%

(1x1) ^(d)	0.430	-32,81%	2.1500	+6,96%		
(2x2) ^(a)	0.250	-60,93%	2.0300	+0,99%	0.6500	+1,56%
Zn vacancy (a)	0.272	-57,5%	2.0420	+1,59%	0.6520	+1,87%

Onde: (a) foram resultados obtidos por cálculos de DFT por Pal et. al (Ref. 1).

- (b) obtidos por cálculos de DFT por Kresse et. al (Ref. 2).
- (c) resultados do PBE de Meyer e Marx (Ref. 3).
- (d) resultados do PBE de Carlsson (Ref. 4).

3.1- Superfície ZnO(0001) 1x1:

Para simular a superfície de ZnO(0001) (1x1), utilizamos um script que roda vários inputs ao mesmo tempo, sendo que em cada input escolhe-se 1 ou 2 parâmetros variáveis, enquanto os outros valores permanecem constantes e no final obtém-se um fator R_a para cada input. Primeiro faz-se uma otimização de vários parâmetros relevantes com o intuito de diminuir o fator R_a . Após isso continua-se a otimização fazendo relaxações das distâncias interplanares, escolhendo então 2 parâmetros de uma vez como, por exemplo, escolher d_{12} e d_{23} . Ao rodar o script, obtemos no final 3 variáveis (d_{12} , d_{23} , R_a) que formam um gráfico tridimensional com tendências a formar um poço. Então podemos com esses dados fazer um plot de gráfico de superfícies das distâncias interplanares relaxadas em função do fator R_a , e nesses gráficos o poço de mínimo corresponde ao menor fator R_a , como podemos ver na figura 8.

rfactors ZnO 1x1 d12 d23

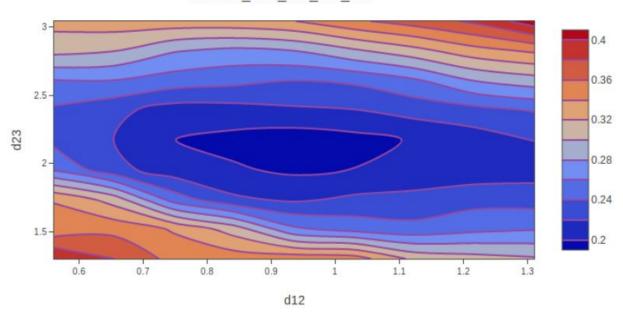


Figura 8. Plot de gráfico de contorno de superfícies com relaxação feita nas distâncias interplanares d_{12} e d_{23} , com o eixo z representando o fator R_a .

Além desse plot, foram realizados mais outros 6 plots. As relaxações seguem a seguinte ordem: 1°: d_{12} e d_{23} , 2°: d_{34} e d_{45} , 3°: d_{56} e d_{67} , 4°: d_{12} e d_{23} , 5°: d_{34} e d_{45} , 6°: d_{56} e d_{67} , 7°: d_{12} e d_{23} . Foi necessário relaxar de novo as mesmas camadas, pois quando se relaxa de novo faz diminuir cada vez mais o fator R_a , pois as relaxações vão aproximando cada vez mais da estrutura real.

Podemos ver na figura 9, a comparação entre os clusters com ou sem relaxação.

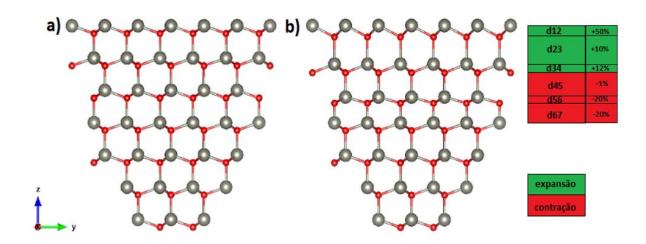


Figura 9.Clusteres obtidos da estrutura de ZnO(1x1), onde em **a)** representa o bulk e em **b)** o cluster obtido através de relaxações em suas distâncias interplanares e suas porcentagens (vista lateral).

Foram realizadas no total 6 relaxações e obtidas 3 expansões nas primeiras camadas e 3 contrações nas próximas camadas.

A figura 10 mostra os padrões de difração obtidos, comparando o dado experimental(1x1) com o bulk(1x1) e o com a relaxação(1x1).

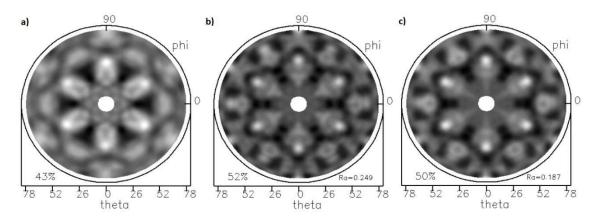


Figura 10. Padrão de difração obtido da estrutura ZnO(1x1) onde o padrão em **a)** representa o dado experimental, em **b)** representa a simulação da superfície considerando as distâncias interplanares de volume e em **c)** com as relaxações feitas.

Com isso seguem os resultados na tabela 2.

Tabela 2. Resultados obtidos do fator R_a do bulk e da estrutura relaxada com suas respectivas distâncias interplanares comparadas com a literatura e porcentagens de relaxação.

	d_{12}	d ₁₂ lit. ^(a)	relax.	d_{23}	d ₂₃ lit. ^(a)	relax.	d_{34}	d ₃₄ lit. ^(a)	relax.	R _a
Bulk	0.62 4	0.640		1.9760	2.0100		0.6240	0.6400		0.24 9
(1x1)	0.93 6	0.460	+50%	2.1736	2.1200	+10%	0.6988	0.5800	+12%	0.18 7

3.2- Superfície ZnO(0001) 2x2:

Para a superfície de ZnO(0001) 2x2, utilizamos o mesmo script que foi utilizado na 1x1. Foram realizados cálculos para as 8 possíveis configurações com as terminações em Zn-A e Zn-B a fim de encontrar o menor fator R_a . Em todos os cálculos foram feitas as otimizações e as relaxações nas distâncias interplanares.

Tabela 3. Resultados obtidos do fator R_a de todas as possíveis configurações das estruturas terminadas em Zn-A e Zn-B com suas respectivas distâncias interplanares comparadas com a literatura.

Terminaçã o	configuração	d_{12}	d ₁₂ lit. ^(a)	d_{23}	d ₂₃ lit. ^(a)	R_a
Zn-A	1	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.1904
Zn-A	2	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.1925
Zn-A	3	0.9984	0.2500	1.9760	2.0300	0.2403
Zn-A	4	0.8985	0.2500	2.0748	2.0300	0.1955
Zn-A(bulk)	5	0.6240	0.2500	1.9760	2.0300	0.1739
Zn-A	5	0.8985	0.2500	1.9760	2.0300	0.1392
Zn-A	6	0.9984	0.2500	1.9760	2.0300	0.1783
Zn-A	7	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.1892
Zn-A	8	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.1889
Zn-B	1	0.8985	0.2500	1.8772	2.0300	0.2072
Zn-B	2	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.2308
Zn-B	3	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.2049
Zn-B	4	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.2075
Zn-B	5	0.8985	0.2500	2.0748	2.0300	0.2119
Zn-B	6	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.2468
Zn-B	7	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.2015
Zn-B	8	0.9484	0.2500	1.9760	2.0300	0.2048

Após as relaxações serem feitas, o menor fator R_a encontrado foi o da configuração 5 com terminação Zn-A. Segue na figura 11 para este resultado obtido o plot de gráfico de superfície.

rfactors_ZnO2x2_d12_d23_1b_termin_Zn-A

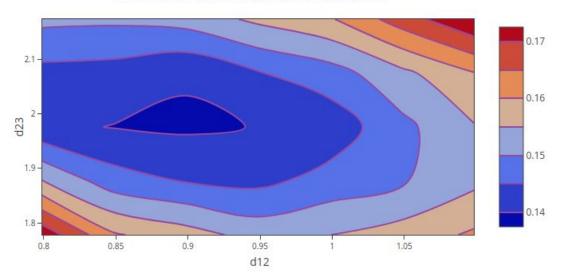


Figura 11. Plot de gráfico de contorno de superfícies com relaxação feita nas distâncias interplanares d_{12} e d_{23} , com o eixo z representando o fator R_a .

Devemos comparar então na configuração 5, o bulk com o resultado que sofreu relaxação. Na figura 12 temos essa comparação, onde essa configuração apresenta apenas uma expansão de 44% na distância entre as 2 primeiras camadas.

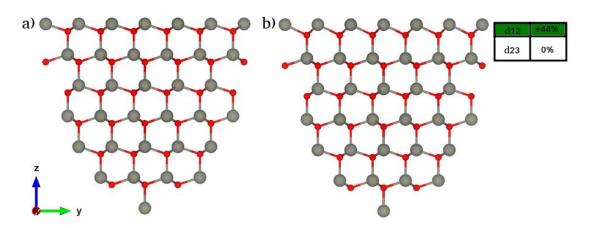


Figura 12. Clusteres obtidos da estrutura de ZnO(2x2), onde em **a)** representa o bulk e em **b)** o cluster obtido através de relaxações em suas distâncias interplanares e suas porcentagens (vista lateral).

A figura 13 mostra os padrões de difração obtidos, comparando o dado experimental(2x2) com o bulk(2x2) e com o relaxado(2x2).

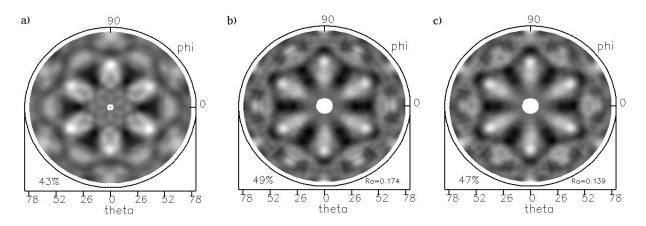


Figura 13. Padrão de difração obtido da estrutura ZnO(2x2) onde o padrão em **a)** representa o dado experimental, em **b)** representa a simulação da superfície considerando as distâncias interplanares de volume e em **c)** com as relaxações feitas.

4- Conclusão:

Os resultados obtidos para a ZnO(1x1) mostram que o fator R_a melhorou de 0.249 para 0.187 quando foram feitas as 6 relaxações, se aproximando mais do resultado experimental, portanto da estrutura real. Porém comparando as distâncias interplanares obtidas com a literatura, mesmo com a melhora do fator R_a , as distâncias interplanares d_{12} se distanciam um pouco do esperado, pois na literatura sempre ocorre contração em torno dos 27%, e no nosso caso ocorreu expansão de 50%. Este resultado ainda está sob investigação. Uma possibilidade que encontramos é de hidrogenação da superfície, visto que na câmara de vácuo em que preparamos o cristal para as medidas, sempre existe uma pressão residual de hidrogênio. Uma observação é que o nosso bulk possui um valor um pouco diferente do da literatura, pois utilizando o bulk da literatura, observou-se uma piora do fator R_a .

Para analisar os resultados obtidos para a ZnO(2x2), primeiro vamos salientar algumas observações.

A primeira observação a ser feita é assumir a hipótese de que não há buracos na primeira camada dos dados experimentais e a estrutura simulada possui buracos. Se não houvessem buracos na primeira camada, então o dado experimental da 2x2 seria idêntico ao da 1x1 e o valor do fator R_a seria piorado devido a estrutura simulada possuir buracos e a do dado experimental não, e então ocorreriam cálculos de difrações errados. E como faltam o mesmo número de buracos em todas as configurações, o fator R_a de todos seriam próximos.

A segunda observação é assumir a hipótese de que há buracos na primeira camada dos dados experimentais e as estruturas simuladas possuem os valores de todas as configurações próximos. Caso isso ocorresse haveria a

possibilidade da estrutura experimental possuir buracos e que a ordem das configurações não importa ou que não há buracos na primeira camada.

O resultado obtido para a ZnO(2x2) mostra então que há buracos na primeira camada realmente, que o dado experimental é realmente uma 2x2 com a estrutura possuindo terminação em Zn-A e que os buracos se organizam de acordo com a configuração 5, e essa configuração mostra que a estrutura possui preferência a formar triângulos completos.

5-Referências:

¹Pal, Jasper-Tönnies.Hack, and Pehlke, Phys. Rev. B 87, 085445 (2013).

²G.Kresse, O.Dulub, and U. Diebold, Phys. Rev. B 68, 245409 (2003).

³B.Meyer and D.Marx, Phys. Rev. B 67, 035403 (2003).

⁴J.M. Carlsson, Comput. Mater. Sci. 22, 24 (2001).

⁵ "MSCD - Multiple Scattering Calculation of Diffraction" por Y. Chen, M.A. van Hove, C. S. Fadley, F. Bondino e R. Diez Muiño. (http://www.icts.hkbu.edu.hk/surfstructinfo/SurfStrucInfo_files/mscd/mscdpack.html)

⁶A.Siervo e L.H. de Lima, Difração de Fotoeletrons. 2017.

⁷L.H. de Lima, "Monocamadas sp2 corrugadas e suas aplicações" (2014), Tese de Doutorado.

⁸Notas de Aula do curso Fl216/F015 – Tópicos de Física Experimental – Técnicas Experimentais Avançadas de Física de Superfícies.

⁹S.Hüffner. Photoelectron Spectroscopy – Principles and Applications. 2nd Edition, Springer.

¹⁰P.Hofmann. Surface Physics : An Introduction. Written and published by P.Hofmann. 2013.

¹¹C.Kittel. Introduction to Solid States Physics. Eighth Edition. Editora: John Wiley & Sons (2014).